

反射率测量仪 | SGRM-200N



可实现微小区域和曲面的反射率测量。

可直接测量未经处理的透明薄板的反射率,并能几乎不受底面反射的影响;可快速高精度测量曲面和平面的反射率。

应用系统

光学元件·
薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

显微镜

光通讯

干涉仪

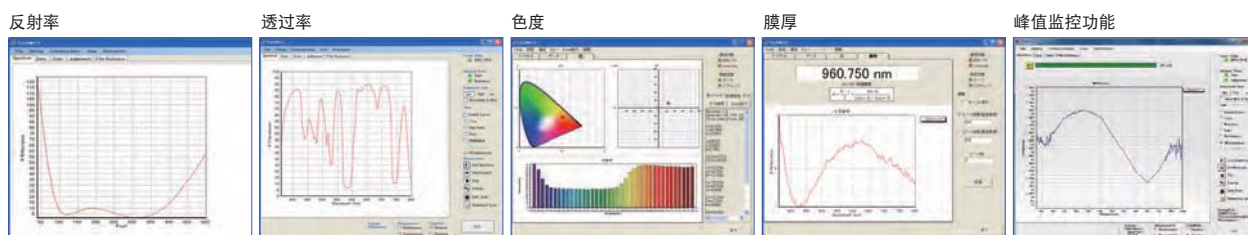
检查 / 观察

生物光学

激光加工

- 采用了特殊结构的半透镜,能高效地收集被测试样的反射光,并高效地导入分光光度计,可快速地完成低反射率样品的测量。
- 采用了特殊的光学结构,有效地避免了底面反射的影响,可直接测量未经处理的透明薄板的反射率。
(使用20倍物镜时,可测最小透明薄板厚度可达0.3mm)
- 采用了特殊卤素灯和独创的光学设计,其有效光量大,获取数据快,重复精度高。
- 测量点小(典型值为 $\phi 50\mu\text{m}$),可直接测曲面,以及膜层的分布特性。
- 结构紧凑,体积小,不占空间。
- 可用Microsoft® Excel® 文件格式保存测量数据。
- 可在同一窗口内,同时显示多个样品的测量结果(曲线),方便数据的对比分析。
- 采用峰值跟踪技术,提高了反射率的重复测量精度

测试结果显示例



技术指标

型号	SGRM-200N
测定波长范围	380~1050nm
样品侧NA	0.22(使用10倍物镜时) 0.44(使用20倍物镜时)
测量光斑尺寸	约 $\phi 25\mu\text{m}$ (使用10倍物镜时)
样品的曲率半径	-2mm~-∞, +2mm~∞
再现性精度	±0.2% (380~450nm) ±0.02% (451~950nm) ±0.2% (951~1050nm)
显示分辨率	1nm
测量时间	数秒(受选定的采样时间影响)
外形尺寸(本体)	270(W)×465(D)×615(H)mm(不含突出部)
工作温度范围	18~28℃
工作湿度范围	60%以下(无结露现象)

物镜（标准配置）		物镜（可选项）
10倍物镜 UPLFLN10x	20倍物镜 UPLFLN20x	1.25倍物镜 PLAPON1.25x
		
测点尺寸: $\phi 50 \mu\text{m}$ 最小可测透明薄板 厚度: 0.4mm	测点尺寸: $\phi 25 \mu\text{m}$ 最小可测透明薄板 厚度: 0.3mm	测点尺寸: $\phi 400 \mu\text{m}$

标准白色板	波长校正板
WS-3（可选项） ※测量颜色用基准板 	V-30（可选项） ※校正波长时使用 (付有校准数据) 
物	物
NY-CZ（可选项） ($\times 0.35 \sim \times 0.7$) 	STC-MCA5MUSB3 (可选项) 



反射率测量软件：SGRMCS（标准附属品）

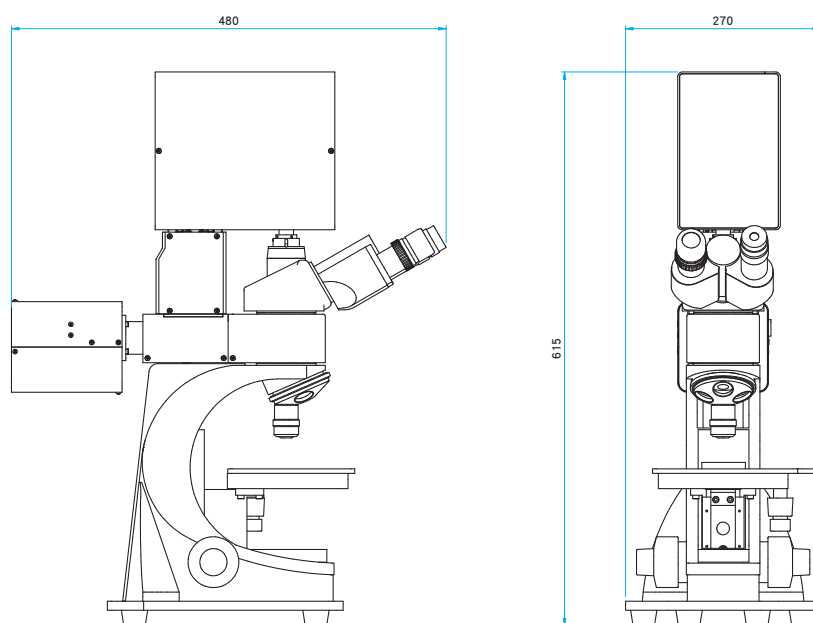
- 实现了薄样品的高精度测量（软件+硬件）
- 可同时显示多个样品的测量结果（最多64个）
- 可用Microsoft® Excel® 文件格式保存测量数据
- 内装合格/不合格判定软件（判断基准最小可设定1nm波长间隔）
- 增加了测量膜厚功能
- 采用峰值跟踪技术便于调焦

备品（标准附属品）

卤素灯（5个1套）
PCL919SMR02VN低反射率基准板
球面平凹透镜
SLB-50-70N高反射率基准板
铝膜反射镜
TFA-50C08-1

外形图

(单位: mm)



自重: 13kg (不含电缆)